

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃ ～ 140℃（注1）	保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃（注2）	
	電 圧	AC 125 V（注3）	保存湿度範囲	相対湿度60%以下 (但し結露の無いこと)	
	電 流	0.5 A	使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) 以下で測定する。	65 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 250Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 375Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 30 N以下 抜去力 3.3 N以上	○	—
	繰り返し動作	10 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 75 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 50～100 → 100～150 → 150～300 Hz、 加速度 98 → 98～294 → 294 m/s ² 、 1 往復 3 分間 3 軸方向 各 3 時間試験する。(注4)	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 980 m/s ² , 持続時間 6 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 60±2℃、湿度 90～95%中に 1000時間放置する。	① 接触抵抗： 75 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 1000 MΩ以上 △2 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -40 → +140℃ 時間 30 → 30分 を 1000 サイクル 試験する。 (槽の移し変え時間は2～3分)		○	—
	耐熱性	温度 140℃中に 1000 時間放置する。	① 接触抵抗： 75 mΩ以下	○	—
	耐寒性	温度 -40℃中に 1000 時間放置する。	② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度 25±5 ppm、40±2℃、80±5%RH 96 時間放置する。	接触抵抗： 75 mΩ以下	○	—
	はんだ耐熱性	【 リフロー 】ピーク温度 MAX260℃ 220℃以上 60秒以内 △1	外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3秒の はんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-F-00016361	TK. ABE	HH. SHINDO	20221215
備考 注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 注3. 沿面距離をIEC 60664-1<汚染度：2>に準拠する場合<AC 32V>となります。 注4. コネクタ実装部の基板振幅量は0.05mm以下とします。			承認	HH. SHINDO	20191007
			検 図	KN. SHIBUYA	20191007
			担 当	TK. ABE	20191007
			製 図	KI. YAMAZAKI	20191007
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-376628-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	FX26-30P-1SV	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0576-1003-0-00	△2 1/1